

Verordnung über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographienverordnung, ToV)

Änderung vom 21. Mai 2008

*Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:*

I

Die Topographienverordnung vom 26. April 1993¹ wird wie folgt geändert:

Art. 16 Bereich

Die Hilfeleistung der Zollverwaltung erstreckt sich auf das Verbringen von Halbleitererzeugnissen, bei denen der Verdacht besteht, dass ihre Verbreitung gegen die in der Schweiz geltende Gesetzgebung über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen verstösst, ins oder aus dem Zollgebiet.

Art. 17 Abs. 1

¹ Die Hersteller und Herstellerinnen oder die klageberechtigten Lizenznehmer und Lizenznehmerinnen (Antragsteller und Antragstellerinnen) müssen den Antrag auf Hilfeleistung bei der Oberzolldirektion stellen.

Art. 18 Zurückbehalten von Halbleitererzeugnissen

¹ Behält die Zollstelle Halbleitererzeugnisse zurück, so verwahrt sie sie gegen Gebühr selbst oder gibt sie auf Kosten des Antragstellers oder der Antragstellerin einer Drittperson in Verwahrung.

² Sie teilt dem Antragsteller oder der Antragstellerin Name und Adresse der Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin beziehungsweise des Anmelders, Besitzers oder Eigentümers, eine genaue Beschreibung, die Menge sowie den Absender im In- oder Ausland der zurückbehaltenen Halbleitererzeugnisse mit.

³ Steht schon vor Ablauf der Frist nach Artikel 77 Absatz 2 beziehungsweise 2^{bis} des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992² fest, dass der Antragsteller oder die Antragstellerin keine vorsorgliche Massnahme erwirken kann, so gibt die Zollstelle die Halbleitererzeugnisse unverzüglich frei.

¹ SR 231.21

² SR 231.1

Art. 18a Proben oder Muster

¹ Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann die Übergabe oder Zusendung von Proben oder Mustern zur Prüfung oder die Besichtigung der Halbleitererzeugnisse beantragen. Anstelle von Proben oder Mustern kann die Zollverwaltung dem Antragsteller oder der Antragstellerin auch Fotografien der zurückbehaltenen Halbleitererzeugnisse übergeben, wenn diese eine Prüfung durch den Antragsteller oder die Antragstellerin ermöglichen.

² Der Antrag kann zusammen mit dem Antrag auf Hilfeleistung bei der Oberzolldirektion oder während des Zurückbehaltens der Halbleitererzeugnisse direkt bei der Zollstelle gestellt werden, welche die Halbleitererzeugnisse zurückbehält.

Art. 18b Wahrung von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen

¹ Die Zollverwaltung weist die Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin beziehungsweise den Anmelder, Besitzer oder Eigentümer der Halbleitererzeugnisse auf die Möglichkeit hin, einen begründeten Antrag auf Verweigerung der Entnahme von Proben oder Mustern zu stellen. Sie setzt ihr oder ihm für die Stellung des Antrags eine angemessene Frist.

² Gestattet die Zollverwaltung dem Antragsteller oder der Antragstellerin die Besichtigung der zurückbehaltenen Halbleitererzeugnisse, so nimmt sie bei der Festlegung des Zeitpunkts auf die Interessen des Antragstellers oder der Antragstellerin und der Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin beziehungsweise des Anmelders, Besitzers oder Eigentümers angemessen Rücksicht.

Art. 18c Aufbewahrung von Beweismitteln bei Vernichtung der Halbleitererzeugnisse

¹ Die Zollverwaltung bewahrt die entnommenen Proben oder Muster während eines Jahres ab der Benachrichtigung der Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin beziehungsweise des Anmelders, Besitzers oder Eigentümers nach Artikel 77 Absatz 1 des Urheberrechtsgesetzes vom 9. Oktober 1992³ auf. Nach Ablauf dieser Frist fordert sie die Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin beziehungsweise den Anmelder, Besitzer oder Eigentümer auf, die Proben oder Muster in ihren beziehungsweise seinen Besitz zu nehmen oder die Kosten der weiteren Aufbewahrung zu tragen. Ist die Anmelderin, Besitzerin oder Eigentümerin beziehungsweise der Anmelder, Besitzer oder Eigentümer dazu nicht bereit oder lässt sie beziehungsweise er sich innerhalb von 30 Tagen nicht vernehmen, so vernichtet die Zollverwaltung die Proben oder Muster.

² Die Zollverwaltung kann anstelle der Entnahme von Proben oder Mustern Fotografien der vernichteten Halbleitererzeugnisse erstellen, soweit damit der Zweck der Sicherung von Beweismitteln gewährleistet ist.

³ SR 231.1

Art. 19 Gebühren

Die Gebühren für die Hilfeleistung der Zollverwaltung richten sich nach der Verordnung vom 4. April 2007⁴ über die Gebühren der Zollverwaltung.

II

Diese Änderung tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.

21. Mai 2008

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Pascal Couchepin

Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova

⁴ SR 631.035

